

校正証明書

依頼者名 : **** 株式会社

品名 : 膜厚計

型式又は能力 : SDM-Pico

製造者名 : 株式会社サンコウ電子研究所

製造番号 : -----

管理番号 : -----

校正結果 : 別紙検査成績書に記載

校正年月日 : 2012年1月11日

校正に用いた標準器

品名	型式	製造者	管理番号	有効期限
標準厚板	50.3 μm	株式会社サンコウ電子研究所	CS01035	2013年4月末
標準厚板	98.9 μm	株式会社サンコウ電子研究所	CS01036	2013年4月末
標準厚板	299.9 μm	株式会社サンコウ電子研究所	CS01037	2013年4月末
標準厚板	1002 μm	株式会社サンコウ電子研究所	CS01038	2013年4月末
標準厚板	2999 μm	株式会社サンコウ電子研究所	CS01039	2013年4月末
標準厚板	4997 μm	株式会社サンコウ電子研究所	CS01040	2013年4月末

校正結果は、別紙の通りであることを証明します。

発行年月日 : 2012年1月11日

〒50-8384 岐阜県岐阜市藪田南1丁目8番4号

株式会社 トレサ

代表取締役 久保田 光治

上記の計測機器は、弊社の「点検校正作業標準」に基づいて校正が行われたことを証明します。
使用基準器は、弊社の「基準器管理標準」に基づいて管理され、直接もしくはメーカーを經由して、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関や、国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関に定期的にトレーサビリティがとれています。

検査成績書

型式又は能力 : SDM-Pico 校正室の条件 : 20 ±2 50% ±30%
 メーカー : 株式会社サンコウ電子研究所 校正年月日 : 2012年1月11日
 製造番号 : ----- 発行年月日 : 2012年1月11日
 管理番号 : ----- 校正実施者 : 松下 武士

1. 外観 良好 ・ 不良

2. 検査結果

電磁誘導式

単位 : μm

検査項目	判定精度	測定値					判定
		1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	
50.8	± 3 %	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	合格
99.4	± 3 %	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	合格
150.2	± 3 %	150.0	149.0	150.0	149.0	149.0	合格
300.2	± 3 %	299.0	299.0	299.0	299.0	299.0	合格
450.4	± 3 %	447.0	448.0	448.0	448.0	448.0	合格
998.7	± 3 %	1002.0	1000.0	1003.0	1000.0	1003.0	合格
1449.1	± 3 %	1451.0	1451.0	1454.0	1452.0	1451.0	合格
2991.9	± 3 %						不合格
4441	± 3 %						不合格
5004.3	± 3 %						不合格
9445.3	± 3 %						不合格

渦電流式

単位 : μm

検査項目	判定精度	測定値					判定
		1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	
50.8	± 3 %	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	合格
99.4	± 3 %	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	合格
150.2	± 3 %	150.0	149.0	150.0	149.0	149.0	合格
300.2	± 3 %	299.0	299.0	299.0	299.0	299.0	合格
450.4	± 3 %	447.0	448.0	448.0	448.0	448.0	合格
998.7	± 3 %	1002.0	1000.0	1003.0	1000.0	1003.0	合格
1449.1	± 3 %	1451.0	1451.0	1454.0	1452.0	1451.0	合格
2991.9	± 3 %						不合格
4441	± 3 %						不合格
5004.3	± 3 %						不合格
9445.3	± 3 %						不合格



株式会社トレサ
岐阜県岐阜市藪田南1丁目8番4号
TEL 058-214-7000
FAX 058-214-7001

トレーサビリティ体系図

